

国际专利分类专门联盟（IPC 联盟） IPC 修订工作组

第四十七届会议
2022年5月9日至13日，日内瓦

报 告

经工作组通过

导 言

1. IPC 修订工作组（下称工作组）于2022年5月9日至13日在日内瓦举行了第四十七届会议。工作组下列成员派代表出席了会议：爱尔兰、爱沙尼亚、澳大利亚、巴西、大韩民国、德国、俄罗斯联邦、法国、芬兰、荷兰、加拿大、捷克共和国、联合王国、罗马尼亚、美利坚合众国、墨西哥、挪威、日本、瑞典、瑞士、沙特阿拉伯、乌克兰、西班牙、以色列、中国、欧亚专利组织（EAPO）和欧洲专利局（欧专局）（27个）。匈牙利、新加坡和印度作为观察员出席。与会人员名单见本报告附件一。

2. 工作组主席奥·施泰因克尔纳先生宣布会议开幕。

3. 世界知识产权组织（产权组织）基础设施和平台部门助理总干事夏目健一郎先生向与会者表示欢迎。

主席团成员

4. 徐宁女士（产权组织）担任会议秘书。

通过议程

5. 经修订的议程在工作组作出修改后获得一致通过，见本报告附件二。

讨论、结论和决定

6. 依照 1979 年 9 月 24 日至 10 月 2 日举行的产权组织领导机构第十届系列会议的决定（见文件 AB/X/32 第 51 段和第 52 段），本届会议的报告仅反映工作组的各项结论（决定、建议、意见等），尤其不反映任何与会者的发言，除非是在工作组任何具体结论作出后对结论表示或者再次表示的保留意见。

IPC 专家委员会第五十三届会议的报告

7. 工作组注意到秘书处就 IPC 专家委员会（下称“委员会”）第五十三届会议所作的口头报告（见文件 IPC/CE/53/2）。

8. 工作组注意到委员会对工作组所做的修订工作表示非常满意，特别是在过去几年 2019 冠状病毒病大流行期间。委员会鼓励各局积极参与 IPC 修订计划，特别是根据 IPC 修订路线图和新兴技术提交修订请求。

9. 工作组还注意到委员会同意指示工作组考虑在年度各次会议之间，在完成“大”修订项目的数量方面采取改进的、更加平衡的工作方式，例如采取逐案处理的方式，同时在报告员、国际局以及作为联合专利分类（CPC）所有者的欧专局和美利坚合众国之间进行协调。

10. 工作组注意到，委员会还讨论了未来工作组会议的可能形式，并强调了亲身参与的重要性，以帮助解决复杂问题、促进有效交换意见，并为会间休息期间进行必要的非正式讨论提供机会，同时也支持远程参与的持续可能性，以便更广泛的参与。委员会还强调了结合工作组混合会议形式，加强利用 IPC 电子论坛的重要性。

11. 工作组进一步注意到，委员会感谢半导体技术专家组（EGST）的牵头主管局欧专局及其所有成员主管局迄今所作的巨大努力，特别是在 IPC 电子论坛上发布首批 C 项目以及在过去几年 2019 冠状病毒病大流行期间所作的努力。

12. 工作组进一步注意到，委员会通过了对《IPC 指南》和《IPC 修订指导》的修正，特别是决定应尽可能避免在 IPC 中使用商标，并对《指导》第 29 段作出相应修改。

五局合作第一工作组——分类工作组第二十二次会议的报告

13. 工作组注意到在五局分类工作组（五局合作第一工作组）第二十二次会议上，日本特许厅代表五大知识产权局（下称五局）所作的口头报告。

14. 工作组注意到，在五局合作第一工作组第二十二次会议期间，五局同意把四个五局合作项目（F 项目）推进到 IPC 阶段。日本特许厅代表五局在电子论坛 [CE 456](#) 项目下，公布了五局正在进行的所有项目和提案的更新清单（见项目文件附件 39），以免 IPC 修订请求与五局正在开展的修订活动相重复。

15. 委员会进一步注意到五局讨论了关于新兴技术和人工智能（NET/AI）相关技术的分类倡议。

IPC 修订计划

16. 工作组讨论了 31 个修订项目，分别是：[C 505](#)、[C 508](#)、[C 509](#)、[C 510](#)、[C 511](#)、[C 512](#)、[C 513](#)、[C 520](#)、[C 521](#)、[C 522](#)、[C 523](#)、[C 524](#)、[F 071](#)、[F 082](#)、[F 089](#)、[F 122](#)、[F 138](#)、[F 141](#)、[F 142](#)、[F 143](#)、[F 149](#)、[F 151](#)、[F 152](#)、[F 156](#)、[F 157](#)、[F 158](#)、[F 159](#)、[F 161](#)、[F 162](#)、[F 163](#)和[F 164](#)。

17. 这些项目的状态和未来行动及期限表在电子论坛上的相应项目中显示。所有决定、意见和技术附件可见电子论坛相应项目的“工作组决定 (Working Group Decision)”附件。

18. 工作组批准了 21 个修订项目，其中 6 个已完成项目涉及分类表修正和定义修正（如果有），即项目 [C 521](#)、[F 151](#)、[F 152](#)、[F 159](#)、[F 161](#) 和 [F 162](#)，分类表和定义修正都将在 IPC - 2023.01 中生效，11 个已完成项目仅涉及分类表修正，即项目 [C 505](#)、[C 508](#)、[C 509](#)、[C 510](#)、[C 511](#)、[C 512](#)、[C 513](#)、[F 138](#)、[F 141](#)、[F 156](#) 和 [F 164](#)，将在 IPC - 2023.01 中生效。同时，21 个项目中有 4 个已完成项目涉及定义，将被纳入 IPC - 2023.01 中，即项目 [F 071](#)、[F 089](#)、[F 122](#) 和 [F 149](#)，工作组在前几届会议上已完成分类表修正。

19. 工作组祝贺 EGST 最终批准首批半导体相关项目的分类表修正，即 [C 510](#)、[C 511](#)、[C 512](#) 和 [C 513](#)，并将其纳入 IPC - 2023.01。工作组向 EGST 的牵头主管局欧专局以及 EGST 的所有成员主管局迄今所作的巨大努力表示感谢，并感谢积极参与这些项目讨论的主管局。工作组期待很快收到 EGST 的下一批修订项目。

IPC 维护

20. 工作组讨论了 12 个维护项目，即：[M 627](#)、[M 633](#)、[M 634](#)、[M 811](#)、[M 812](#)、[M 814](#)、[M 815](#)、[M 817](#)、[M 818](#)、[M 819](#)、[M 820](#) 和 [M 821](#)。

21. 这些项目的状态和未来行动及期限表在电子论坛上的相应项目中显示。所有决定、意见和技术附件可见电子论坛相应项目的“工作组决定 (Working Group Decision)”附件。

22. 工作组完成了关于分类表或定义修正的八个维护项目，将被纳入 IPC - 2023.01，即：[M 627](#)、[M 633](#)、[M 634](#)、[M 811](#)、[M 818](#)、[M 819](#)、[M 820](#) 和 [M 821](#)。

23. 工作组同意设立七个新的维护项目，即：

化学： M 822 (A23B, A23C, A23L, 报告人 - 欧专局) - 源自项目 [M 812](#)；

M 823 (B01J, 报告人 - 欧专局) - 源自项目 [C 520](#)；

电学： M 824 (H01M, 报告人 - 欧专局) - 源自项目 [F 082](#)；

M 826 (G03B, H04N, 报告人 - 联合王国) - 源自项目 [C 505](#)；

M 827 (G10L, 报告人 - 德国) - 源自项目 [M 633](#)；

M 828 (G01K 和 G01M, 报告人 - 加拿大) - 源自项目 [M 633](#)；以及

技术独立： M 825 (报告人 - 爱尔兰) - 源自项目 [C 510](#)。

M 200 至 M 500 项目中删除非限制性参见 (NLR) 的状况

24. 讨论基于国际局编拟的关于从 IPC 分类表中删除非限制性参见维护项目的状况报告（见项目文件 [WG 191](#) 附件 42）。

25. 工作组注意到，在正在执行的 23 个项目中，电子论坛的讨论已经就以下 12 个项目达成一致，因此这些项目可以视为完成。因此，相应的分类表修正和定义修正将包含在 IPC - 2023.01 中。

[M 223](#) 删除 B01L 小类中的非限制性参见（报告人 - US）

[M 241](#) 删除 B03C 小类中的非限制性参见（报告人 - US）

M 242	删除 C09C 小类中的非限制性参见（报告人 - US）
M 243	删除 C23C 小类中的非限制性参见（报告人 - US）
M 244	删除 D01C 小类中的非限制性参见（报告人 - US）
M 254	删除 H02B 小类中的非限制性参见（报告人 - US）
M 255	删除 H02G 小类中的非限制性参见（报告人 - US）
M 257	删除 E04H 小类中的非限制性参见（报告人 - US）
M 258	删除 A41 大类中的非限制性参见（报告人 - US）
M 260	删除 G10H 小类中的非限制性参见（报告人 - US）
M 261	删除 G10K 小类中的非限制性参见（报告人 - US）
M 266	删除 A21C 小类中的非限制性参见（报告人 - IL）。

26. 工作组注意到，联合王国和瑞典分别志愿作为小类 B64G 和以及大类 F22 和 F27 下所有小类删除非限制性参见工作的报告员，即项目 M 267（B64G，报告人 - GB）、M 268（F22，报告人 - SE）和 M 269（F27，报告人 - SE），并向其表示感谢。

27. 秘书处表示，从分类表中删除非限制性参见的状况总结表经更新后，将在项目文件 [WG 191](#) 下发布。

工作组下届会议

28. 工作组对其下届会议的预期工作量进行评估之后，同意在前两天半处理电学领域，随后的下午和第二天上午处理化学领域，最后一天半处理机械领域。

29. 工作组注意到第四十八届会议的暂定会期如下：

2022 年 11 月 7 日至 11 日

30. 本报告于 2022 年 6 月 3 日由工作组以电子方式一致通过。

[后接附件]

LISTE DES PARTICIPANTS/**LIST OF PARTICIPANTS****I. ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES**

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États)

(in the alphabetical order of the names in French)

ALLEMAGNE/GERMANY

Armin BARTHEL (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Elisabeth ESSEL (Ms.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trademark Office (DPMA), Munich

Martina FRITZSCHE-HENKE (Ms.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Justus Sebastian KRUSE (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office, Munich

Steffen MÜNCH (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich,

Alessandra SANI (Ms.), Senior Adviser, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Thomas SCHENK (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Florian SIEBEL (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Michaela Katja STANGL (Ms.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Oliver STEINKELLNER (Mr.), Head, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Veronika TINKL (Ms.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Abdulahakim ALSAEED (Mr.), Senior Examiner, IP Operations Patents / Mechanical Engineering Department, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Fahad ALNAFJAN (Mr.), Patents Expert, Patents Directorate, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Rawabi ALMUHIMED (Ms.), Patent Examination Specialist, Patents Department, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Abdulahakim ALSAEED (Mr.), Senior Examiner, IP Operations, Patents/ Mechanical Engineering Department, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Abdullah ALGHAMD I (Mr.), Patents Expert, Patents Department, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Faisal Saihan S. ALOTAIBI (Mr.), Senior IP Information Analyst, IP Information Center, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Lloyd JAMES (Mr.), Examiner, Patents Examination Group, IP Australia, Canberra
Markus KLAIBER (Mr.), Examiner, Patents Examination Group, IP Australia, Canberra
Deb MCDONNELL (Ms.), Examiner, Patents Examination Group, IP Australia, Melbourne
Alex SIMMONS (Mr.), Patent Examiner, Patents Examination Group, IP Australia, Canberra
Mu-En TIEN (Mr.), Patent Examiner, Patents Examination Group, IP Australia, Canberra

BRÉSIL/BRAZIL

Darcio GOMES PEREIRA (Mr.), National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Economy, Campinas, São Paulo, Brazil
Tatielli BARBOSA (Ms.), Patent Examiner, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Economy, Rio de Janeiro
Maria Raquel CATALANO DE SOUSA (Ms.), Patent Examiner, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Economy, Rio de Janeiro

CANADA

Nancy BEAUCHEMIN (Ms.), gestionnaire de programme - International CIB/CPC, Office de la propriété intellectuelle du Canada (CIPO) - Direction des brevets, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Gatineau

CHINE/CHINA

LI Xiao (Ms.), Senior Program Administrator, Patent Documentation Department, Patent Office, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing
DONG Qian (Ms.), Deputy Divisional Director, China Patent Technology Development Corporation, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing
LI Bo (Ms.), Divisional QC Manager, China Patent Technology Development Corporation, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing
NAN Nan (Mr.), Examiner, Patent Examination Cooperation Beijing Center, Patent Office, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing
TONG Jingyi (Ms.), Examiner, Patent Examination Cooperation Beijing Center, Patent Office, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing
DONG Yan (Ms.), Program Administrator, Patent Documentation Department, Patent Office, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

ESPAGNE/SPAIN

Elena PINA (Sra.), Técnica Superior Examinadora de Patentes, División de física y de patentes eléctricas, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (OEPM), Madrid

ESTONIE/ESTONIA

Tiina LILLEPOOL (Ms.), Principal Examiner, The Estonian Patent Office, Tallinn

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

William BREWSTER (Mr.), Supervisor Patent Classifying, Classification Standards and Development, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Matthew BROOKS (Mr.), Supervisory Patent Classifier - Mechanical, Classification Standards and Development, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Jill GRAY (Ms.), Patent Classifier - Chemical, Classification Standards and Development, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Chris JETTON (Mr.), Mechanics Classifier, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Gustavo LOPEZ (Mr.), Patent Classifier - Electrical, Classification Standards and Development, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Yasmine FULENA (Ms.), IP Advisor, USUN Geneva, Geneva

Marina LAMM (Ms.), IP Attaché, USUN Geneva, Geneva

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Vladislav MAMONTOV (Mr.), Head, Multilateral Cooperation Division, International Cooperation Department, Federal Service for Intellectual Property - Rospatent, Moscow

Lada TSIKUNOVA (Ms.), Deputy Head, IPC, Federal Service for Intellectual Property - Rospatent, Moscow

FINLANDE/FINLAND

Hanna AHO (Ms.), Head of Division, Patents and Trademarks, Mechanical and Civil Engineering, Finnish Patent and Registration Office (PRH), Helsinki

FRANCE

Magalie MATHON (Mme), examinatrice en charge de mission CIB, Département des brevets, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

David DURIEZ (M.), expert en chimie, Département des brevets, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

Géraldine VENTORUZZO (Mme), expert en électricité, Département des brevets, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

Carole BREMEERSCH (Mme), conseillère propriété intellectuelle, Pole économique, Mission permanente, Genève

IRLANDE/IRELAND

Fergal BRADY (Mr.), Examiner of Patents, Patent Examination, Intellectual Property Office of Ireland, Department of Enterprise, Trade and Employment, Kilkenny

ISRAËL/ISRAEL

Orit REGEV (Ms.), Deputy Superintendent of Examiners, Israel Patent Office, Ministry of Justice, Jerusalem

JAPON/JAPAN

Sumio MIGITA (Mr.), Deputy Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Satoshi ABE (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Kotaro FUJISHIMA (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Shota HOSOKAWA (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Michiru MIURA (Ms.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Kazuhide NAKANO (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Ayano NISHITA (Ms.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Yuto NISHIZUKA (Mr.), Assistant Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Yusuke OKATANI (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Toshinori OTSUKA (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Takuya YASUI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission of Japan, Permanent Mission, Geneva

MEXIQUE/MEXICO

Kevin Uriel ALENCASTER VILLA (Sr.), IP Expert, Divisional Direction of International Affairs, Mexican Institute of Industrial Property (IMPI), Mexico City

Pedro Christian AYALA ROSALES (Sr.), IP Expert, Divisional Direction of Patents, Mexican Institute of Industrial Property (IMPI), Mexico City

Ayari FERNANDEZ SANTA CRUZ RUIZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

Miguel GONZALEZ AGUILAR (Sr.), IP Expert, Divisional Direction of Patents, Mexican Institute of Industrial Property (IMPI), Mexico City

Diana HEREDIA GARCÍA (Sra.), Divisional Director, Divisional Direction of International Affairs, Mexican Institute of Industrial Property (IMPI), Mexico City

Gustavo JARAMILLO NAVARRETE (Sr.), IP Expert, Divisional Direction of Patents, Mexican Institute of Industrial Property (IMPI), Ciudad de México

Alicia MARMOLEJO FLORES (Sra.), IP Expert, Divisional Direction of Patents, Mexican Institute of Industrial Property (IMPI), Mexico City

Pablo ZENTENO MARQUEZ (Sr.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

Hosanna MORA GONZÁLEZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

NORVÈGE/NORWAY

Bente AARUM-ULVÅS (Ms.), Senior Examiner, Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Robert SCHOUWENAARS (Mr.), Technical Advisor, Netherlands Patent Office, Ministry of Economic Affairs, The Hague

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

PARK Sungchul (Mr.), Deputy Director, Patent Legal Administration Division, Daejeon

Wangseok LEE (Mr.), Head of Group, IPC Revision Group, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

CHA HyunSoo (Mr.), Research Engineer, IPC Revision Group, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

JUNG Juhee (Ms.), IPC Revision Group, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

KIM Joohyeok (Mr.), Research Engineer, IPC Revision Group, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

LEE Jaehoen (Mr.), IPC Revision Group, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

PARK Hyunchul (Mr.), IPC Revision Group, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

YOON Inseok (Mr.), IPC Revision Group, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

LEE Jinyong (Mr.), IP Attache, Economy, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Jarmila AVRATOVA (Ms.), Engineer, Patent Information, Industrial Property Office of the Czech Republic, Prague

ROUMANIE/ROMANIA

Florica ENEA (Ms.), Examiner and Head of Department, Electrical Department, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

Ana PREJBEANU (Ms.), Examiner, Formal Examination, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Jeremy COWEN (Mr.), Senior Patent Examiner - Classification, Patent Examining Division, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

Patrick PURCELL (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Examining Division, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

William (Bill) RIGGS (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Examining Division, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

Huw THOMAS (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Examining Division, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

Rhys WILLIAMS (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Examining Division, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

Jan WALTER (Mr.), Senior IP Adviser, Permanent Mission, Geneva

SUÈDE/SWEDEN

Anders BRUUN (Mr.), Patent Expert, Swedish Intellectual Property Office (PRV), Stockholm

Tomas LUND (Mr.), Senior Patent Examiner, Swedish Intellectual Property Office (PRV), Stockholm

SUISSE/SWITZERLAND

Pascal WEIBEL (M.), chef Examen, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Philippe TATASCIORE (M.), expert en brevet, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Michael STALDER (M.), expert en brevet, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Charlotte BOULAY (Mme), Legal Advisor, Division of Legal and International Affairs, Swiss Federal Institute of Intellectual Property, Bern

UKRAINE

Bohdan PADUCHAK (Mr.), Deputy Director, Department for Intellectual Property, Ministry of Economy of Ukraine, Kyiv

II. ÉTATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATESHONGRIE/HUNGARY

Ildikó DIÓSPATONYI (Ms.), Patent Examiner, Pharmaceuticals and Agriculture Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

Zsuzsanna TÖRŐCSIK (Ms.), Patent Examiner, Chemistry and Biotechnology Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

INDE/INDIA

A. Seetha Raman (Mr.), Examiner of Patents and Designs, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Chennai

Saurabh DWIVEDI (Mr.), Examiner of Patents and Designs, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Kolkata

Vishakha GUPTA (Ms.), Examiner of Patents and Designs, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, New Delhi

SINGAPOUR/SINGAPORE

Ning DU (Ms.), Patent Examiner, Patent Search, Examination and Analytics, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

Lei HONG (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Search, Examination and Analytics, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

Cheow Hin SIM (Ms.), Patent Examiner, Patent Search, Examination and Analytics, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

Happy TAN (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Search, Examination and Analytics, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT ORGANIZATION (EAPO)

Dmitrii GUDILIN (Mr.), Principal Examiner, Mechanics, Physics and Electrical Engineering Division, Examination Department, Moscow

Elena LUBYAKO (Ms.), Principal Examiner, Chemistry and Medicine Division, Examination Department, Moscow

Valery MALAY (Mr.), Principal Examiner, Mechanics, Physics and Electrical Engineering Division, Examination Department, Moscow

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT ORGANISATION (EPO)

Roberto IASEVOLI (Mr.), Head, Classification Board, Rijswijk

Maarten ALINK (Mr.), Classification Board, Munich

Jérôme CARRÉ (Mr.), Classification Board, Munich

Massimo CRESCENTI (Mr.), Classification Board, Rijswijk

Agnès GAMEZ MERLE (Ms.), Classification Board, Rijswijk

Nathalie GEISLER (Ms.), Classification Board, Rijswijk

Silvia GENNARI (Ms.), Classification Board, Munich

Ciro PERNICE (Mr.), Classification Board, Rijswijk

Mark PLEHIERS (Mr.), Classification Board, Rijswijk

John RENGGLI (Mr.), Classification Board, Munich

Peter SWARÉN (Mr.), Classification Board, Rijswijk

Erik TORLE (Mr.), Classification Board, Munich

Daniela VANATA (Ms.), Classification Board, Munich

Rossana VINCI (Ms.), Classification Board, Rijswijk

Norbert WIENOLD (Mr.), Classification Board, Munich

IV. BUREAU/OFFICERS

président/Chair: Oliver STEINKELLNER (M./Mr.) (ALLEMAGNE/GERMANY)

vice-président/
Vice Chair: Pascal WEIBEL (M./Mr.) (SUISSE/SWITZERLAND)

secrétaire/Secretary: XU Ning (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO)

V. BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Ken-ichiro NATSUME (M./Mr.), sous-directeur général du Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Assistant Director General, Infrastructure and Platforms Sector

Kunihiko FUSHIMI (M./Mr.), directeur de la Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Director, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

XU Ning (Mme/Ms.), chef de la Section de la classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Head, International Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

Rastislav MARČOK (M./Mr.), administrateur principal de la classification des brevets de la Section de la classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Senior Patent Classification Officer, International Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

Olivier COLLIOUD (M./Mr.), Administrateur de projets la de la Section des systèmes informatiques, Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes /Project Officer, IT Systems Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

Isabelle MALANGA SALAZAR (Mme/Ms.), assistante à l'information de la Section de la classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Information Assistant, International Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

[后接附件二]

议 程

1. 会议开幕
2. 通过议程
3. IPC 专家委员会第五十三届会议的报告
见文件 IPC/CE/53/2。
4. 五局合作第一工作组——分类工作组第二十二届会议的报告
由日本特许厅代表五局进行口头报告。
5. 涉及机械领域的 IPC 修订项目
参见项目 [C 521](#)、[F 089](#)、[F 138](#)、[F 156](#)、[F 157](#)、[F 162](#) 和 [F 163](#)。
6. 涉及电学领域的 IPC 修订项目
参见项目 [C 505](#)、[C 508](#)、[C 509](#)、[C 510](#)、[C 511](#)、[C 512](#)、[C 513](#)、[C 522](#)、[C 523](#)、[C 524](#)、[F 071](#)、[F 141](#)、[F 142](#)、[F 143](#)、[F 149](#)、[F 151](#)、[F 158](#)、[F 159](#) 和 [F 164](#)。
7. 涉及化学领域的 IPC 修订项目
参见项目 [C 520](#)、[F 082](#)、[F 122](#)、[F 152](#) 和 [F 161](#)。
8. 涉及机械领域的 IPC 维护项目
参见项目 [M 634](#)、[M 811](#)、[M 814](#) 和 [M 817](#)。
9. 涉及电学领域的 IPC 维护项目
参见项目 [M 633](#)、[M 815](#)、[M 819](#) 和 [M 820](#)。
10. 涉及化学领域的 IPC 维护项目
参见项目 [M 627](#)、[M 812](#)、[M 818](#) 和 [M 821](#)。
11. M 200 至 M 500 项目中删除非限制性参见（NLR）的状况
参见项目 [WG 191](#)。
12. 工作组下届会议
13. 通过报告
14. 会议闭幕

[附件二和文件完]